

芯片相似性比对检验方法

Examination methods for similarity comparison of integrated circuit chips

中华人民共和国公共安全
行业标准
芯片相似性比对检验方法
GA/T 1171—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

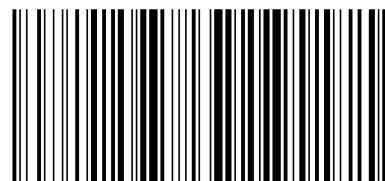
*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字
2014年9月第一版 2014年9月第一次印刷

*

书号: 155066·2-27341 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GA/T 1171—2014

2014-07-09 发布

2014-07-09 实施

中华人民共和国公安部 发布

5 检验步骤

5.1 检材和样本编号

对送检的检材和样本进行唯一性编号。

5.2 检材和样本拍照

对送检的检材和样本进行拍照。

5.3 检材和样本备份

制作原始检材的副本或镜像。

5.4 检材和样本的功能检验

对具备功能检验条件的检材和样本进行功能检验。

5.5 布图与芯片的一致性检查

分别检查检材、样本的布图与芯片的一致性,即验证芯片是否是由布图生成的。

5.6 数字模块相似性比对

5.6.1 网表与布图的一致性检查

分别检查检材、样本的网表与布图的一致性,即验证布图是否是由网表生成的。

5.6.2 布图的相似性比对

分别从检材、样本的总布图中提取相似的功能模块的布图,并进行几何形状的比对。

5.6.3 RTL 代码与网表的一致性检查

分别检查检材、样本的 RTL 代码与网表的一致性,即验证网表是否是由 RTL 代码生成的。

5.6.4 网表的比对

比对检材、样本的总网表,比较两者的模块数,相似模块的功能、标识、注释。比对时忽略标识名的不同,从逻辑来进行判别。

5.6.5 RTL 代码的比对

比对检材和样本的 RTL 代码,比较代码的目录结构,代码文件名,文件内容,功能,标识,注释。比对时忽略标识名的不同,从逻辑来进行判别。

5.7 模拟模块相似性比对

5.7.1 电路原理图与布图一致性检查

分别检查检材与样本的电路原理图与布图的一致性,即验证布图是否是由电路原理图生成的。

5.7.2 布图的相似性比对

分别从检材和样本的总布图中提取相似的功能模块的布图,并进行几何形状的比对。

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部第三研究所提出。

本标准由公安部信息安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部第三研究所。

本标准主要起草人:沙晶、金波、杭强伟、蔡立明、徐隽。